

*a/a*



*б/б*



*Рис. 4.* Микроструктура деформированной части образца под действием тока и СВЧ-излучения (*а*) и в отсутствие тока (*б*).

Изображения получены с помощью инвертированного металлографического микроскопа ЕРІРНОТ 200 (*Nikon*, Япония)

*Fig. 4.* Metal microstructure affected by electric current and microwave radiation (*a*) and non-affected by electric current (*b*).

Images were obtained using an inverted metallographic microscope ЕРІРНОТ 200 (*Nikon*, Japan)